高性能 Ag-Pb-Sb-Te 体系半导体热电材料的制备与性能

周敏 李敬锋* 王衡

(清华大学材料科学与工程系,新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室,北京 100084.* 联系人, E-mail: jingfeng@mail.tsinghua.edu.cn)

摘要 采用机械合金化(MA)和放电等离子烧结(SPS)方法制备了高性能的Ag-Pb-Sb-Te体系块体热电材料. 利用XRD和SEM等表征手段分析了材料的物相组成和微观结构, 详细研究了组分变化, 尤其是Pb 含量的改变对Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀体系材料热电性能(包括电阻率、Seebeck系数、功率因子、热导率和热电优值等)的影响规律. 研究表明, Ag-Pb-Sb-Te体系材料的最佳组成为Ag_{0.8}Pb_{22.5}SbTe₂₀, 对应的最大热电优值为 1.2(673 K).

关键词 热电材料 机械合金化 放电等离子烧结 热电性能

21 世纪、大量的能源消耗与严重的环境污染已 成为阻碍现代经济发展的焦点问题、开发替代常规 矿物能源的环境友好型洁净能源及能量转换技术已 成为我国乃至世界能源环境战略中一项十分重要的 内容、其中热电转换技术是最受瞩目的新型能量转 换技术之一. 热电转换技术是一种利用半导体材料 直接将热能与电能进行相互转换的技术、可以实现 废热发电和极端环境能源供给以及电子制冷等技术 应用[1-4]. 热电转换效率的高低主要取决于热电材料 的性能优劣、热电材料的性能通常用无量纲热电优 值*ZT*表示, *ZT* = $\alpha^2 \sigma T/\kappa$, 式中 α , σ , *T*和 κ 分别为 Seebeck系数、电导率、绝对温度和热导率、 $\alpha^2 \sigma$ 被称 为功率因子,反映材料的电传输性能.热电材料在使 用中(热电发电或者电子制冷)的热电转换效率取决 于ZT值的大小、ZT值越大、热电转换效率越高. 好的 热电材料通常具有较大的 Seebeck 系数和电导率。同 时具有较小的热导率, 而以上三者并不是彼此独立 的,都受制于载流子浓度的大小.因此,改善电传输 性能、控制声子热传导来降低材料热导率是热电发电 领域的主要研究方向^[5].例如,通过掺杂优化载流子 浓度、以及量子限制效应来提高材料的功率因子[6~9]; 在具有"声子玻璃-电子晶体"结构特征的方钴矿 (skutterudite)和笼形化合物(clathrate)等化合物[10~13] 结构中的间隙位置填充适当的原子,引起晶格"扰 动"(rattling),大幅度降低材料的热导率;多层薄膜

结构中由于存在大量的界面散射声子,使热导率减 小^[14].此外,通过分子束外延生长(MBE)的薄膜超晶格 结构,如Bi₂Te₃/Sb₂Te₃^[5]和PbSe_{0.98}Te_{0.02}/PbTe^[15-17]等 也具有很低的热导率,这就使得热电优值大大提高. 几十年来,块体材料的热电优值一直在 1 左右徘徊, 直至近两三年来才取得长足的发展,尤其是 Hsu 等 人^[18]报道了AgPb_mSbTe_{2+m}化合物热电材料,采用高温 (850)熔融,长时间(40 h)慢速降温至 450 的方法制 备材料,其热电优值最大可达 2.1.如此优良的热电性 能可能与基体中分布的富集 Ag-Sb 的纳米量子点有关, 这些量子点在纳米尺度上的成分波动引起的纳米量子 结构对降低热导率起了关键作用^[19-21],热电优值也因 此而提高.与薄膜材料相比,块体热电材料更易于获得 较大的温差,实现工业化生产.

放电等离子烧结(SPS)技术是一种高效、低耗的 块体材料制备方法.一般认为,其烧结机理主要是利 用外加脉冲强电流形成的电场清洁粉末颗粒表面氧 化物和吸附的气体,使粉体表面得到净化和活化,提 高粉末表面的扩散能力,在较低机械压力下利用强 电流短时加热粉体进行烧结^[22,23].与热压(HP)及热 等静压(HIP)等技术相比,SPS 技术具有很多优点,如 烧结温度低(比HP和HIP低200~300),烧结时间短 (只需 3~10 min,而 HP和 HIP 需要 120~300 min),单 件能耗低,其消耗的电能仅为传统烧结工艺(无压烧 结、热压烧结、热等静压)的 1/5~1/3.由于烧结时间

²⁰⁰⁶⁻⁰⁷⁻²⁵ 收稿, 2006-11-27 接受

国家自然科学基金(批准号: 50325207), 国家自然科学基金重大国际合作研究项目(批准号: 50310353)和清华大学-日本丰田汽车公司国际 合作研究项目(项目号: 0501J08)资助

短, 温度低, 晶粒生长速度缓慢, 使得烧结体的晶粒 细小, 有利于减小热导率. 因此, SPS 烧结技术在新 材料研究和生产领域, 如热电材料领域, 已获得越来 越广泛的应用. 与以上所述的传统熔炼方法相比, Wang等人^[24]采用经济高效的机械合金化和放电等离 子烧结方法制备了富集 Pb 的 Ag-Pb-Sb-Te 体系热电 材料, 其热电优值最大为 1.37. 鉴于 MA+SPS 制备方 法不仅经济高效而且易于获得细晶材料, 本文采用 机 械 合 金 化 和 放 电 等 离 子 烧 结 方 法 制 备 $Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe_{20}(x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)$ 化合物块体材料, 并系统研究了 Pb 含量的变化对材料电传输性能和热 导率的影响规律.

1 实验

Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀(*x* = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)化合物粉体 采用机械合金化的方法合成.将高纯度的 Pb 粉 (99.9%, 75 μm), Te 粉(99.999%, 150 μm), Ag 粉(99.9%, 150 μm)和 Sb 粉(99.9999%, 150 μm)按以上化合物的 化学计量比称量并混和均匀,然后置于不锈钢球磨 罐中,不锈钢球与原料的重量比约为20:1.将不锈钢 罐密封后抽真空,然后通入Ar+H₂混和气体以防止原 料在球磨过程中氧化.在 QM-2L 型行星式球磨机上 以 350 r/min 的转速球磨4h,合金化完成后加入适量 的乙醇继续球磨:一方面细化晶粒,另一方面解决球 磨罐壁原料黏附问题.然后取出原料烘干,用放电等 离子烧结(SPS)的方法制备块体材料.SPS 烧结在真 空中进行,烧结温度和时间分别为400 和5 min,烧 结过程中压力为 50 MPa.

样品的物相组成用 X 射线衍射(XRD)分析得到, 材料的断口形貌用扫描电子显微镜(SEM)观察. 载 流子浓度用 Hall 测试系统(Accent 5500)测试, 电导率和 Seebeck 系数用 ZEM-2 型电导率/Seebeck 系数测试系统测试. 材料的热导率(κ)由热扩散系数 (λ)、热容(C_p)和密度(d)三者的乘积得到, 即 $\kappa = \lambda C_p d$, 其中热扩散系数用脉冲激光微扰法(NETZSCH LFA-427)测得, 热容采用差示扫描量热法(DSC)测试, 样 品的密度用阿基米德法测试.

2 结果与讨论

图 1 为Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀(*x* = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)材料 的 X 射线衍射图, 其中(a)和(b)分别对应于机械合金 化得到的粉体材料和 SPS 烧结得到的块体材料. 从 图中可以看出, 机械合金化得到了面心立方结构的 PbTe 相, 当 Pb 过量(即 x > 0)时, XRD 图谱上还出现 了少量 Pb 的衍射峰, 这说明过量的 Pb 并没有完全进 入 PbTe 的 Pb 亚晶格中, 而是以 Pb 单质的形式存在. 用 SPS 烧结成块体之后, 其 X 射线衍射峰与粉末的 衍射峰相比更尖锐, 说明晶格在烧结之后更加完整. 由于在高温烧结过程中 Pb 的挥发而使 Pb 含量降低, 导致Ag_{0.8}Pb₁₈SbTe₂₀化合物中Te相对过量, 在相应 的块体 XRD 图谱上可看到 Te 的衍射峰. 而对于其他 Pb 含量 x > 0 的样品, 对应的 Pb 衍射峰强度减弱, 甚 至在Ag_{0.8}Pb_{21.5}SbTe₂₀和Ag_{0.8}Pb₂₂SbTe₂₀的XRD图谱 上已看不到 Pb 的衍射峰.





图 2 示出了Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀材料断口的SEM图. 从材料的断口形貌可以看到,部分晶粒的断面不清 晰,这是穿晶断裂的特征.选取几个典型试样 (Ag_{0.8}Pb₁₈SbTe₂₀, Ag_{0.8}Pb_{21.5}SbTe₂₀和Ag_{0.8}Pb_{22.5}SbTe₂₀) 的断口形貌分别示于图 2(a)~(c).按文献[18]中



图 2 Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀材料的断口形貌(SEM) (a) x = 0; (b) x = 3.5; (c) x = 4.5

 $Ag_{0.8}Pb_mSbTe_{m+2}$ (*m* = 18)成分配比制备的样品,在其断口形貌图上可看到大量的气孔(图 2(a)),测试其相对密度仅有 85%.提高Pb的含量,断口形貌中的可见 气孔减少,致密度提高,相对密度达到 95%以上.根据图 1 的XRD结果得知,随着Pb含量的增加,材料中 逐渐出现了Pb的衍射峰.这些过量的Pb在SPS烧结过 程中可能对材料的致密化起了促进作用.

图 3 示出了不同Pb含量样品Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)的电阻率与温度的关系图. 由图 3 的插图可以看出, 当x=0 时, 化合物组成为Ag_{0.8}-Pb₁₈SbTe₂₀, 其室温电阻率约为 $1.6 \times 10^{-3} \Omega$ ·m. 随着温度的升高电阻率迅速减小, 当温度升高至 673 K时, 化合物的电阻率降低了两个数量级, 表现出典型半导体的电传输特性. 增加化合物中Pb的含量, 化合物的电阻率显著减小(图 3), 当Pb含量增加至 22.5 时, 化合物的组成为Ag_{0.8}Pb_{22.5}SbTe₂₀, 该化合物的电阻率最小, 其室温电阻率仅有 $7 \times 10^{-5} \Omega$ ·m. Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀化合物载流子浓度的测试结果示于



图 3 Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)电阻率与温度 的关系图

表 1. 从表 1 可以看到, 随着 Pb 含量的增加, 化合物 的载流子浓度增大. 因此, 我们推测化合物电阻率随 Pb 含量的增加而减小的原因与载流子浓度的增加有 关. 另外, 由前面的讨论得知, 增加 Pb 的含量, 材料

第52卷第1期 2007年1月 斜谷道报

表 1 $Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe_{20}$ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)化合物的室温载流子浓度

	$Ag_{0.8}Pb_{18}SbTe_{20} \\$	$Ag_{0.8}Pb_{21.5}SbTe_{20}$	$Ag_{0.8}Pb_{22}SbTe_{20}$	$Ag_{0.8}Pb_{22.5}SbTe_{20}$	$Ag_{0.8}Pb_{23}SbTe_{20}\\$
$n/10^{18} {\rm cm}^{-3}$	+0.12	-3.94	-5.85	-6.63	-2.67

的密度提高, 这对材料电阻率的减小可能也有影响. 当 Pb 的含量增加至 x > 4.5 时, 化合物的电阻率反而 增大, 尤其是低温电阻率增大较为明显, 这与载流子 浓度减小的结果是一致的(表 1). 这可能是由于在样 品制备过程中过量的 Pb 固溶进入晶体结构或氧化而 导致的 Pb 含量减小所致.

图 4 示出了不同Pb含量样品Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)的Seebeck系数与温度的关系. 如图 4 的插图所示, Ag_{0.8}Pb₁₈SbTe₂₀化合物的Seebeck系数在 整个测试温度区间(323~673 K)内均为正值、表明是P 型传导. 根据文献报道^[10], PbTe化合物的电传导接近 于本征态传导, Pb过量(即Pb/Te > 1)时, 类似于施主 掺杂, 电子传导占主导地位, 表现为N型传导; 而Te 过量(即Pb/Te < 1)时, 类似于受主掺杂, 空穴传导占 主导地位,表现为P型传导.在Ago 8Pb18SbTe20化合物 中、一方面Ag的加入量不足、另一方面在材料制备 过程中、尤其是高温烧结过程中Pb的挥发、导致Te相 对 过 量 、 结 果 材 料 表 现 为 P 型 传 导 . 增 加 $Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe_{20}$ 化合物中Pb的含量至过量(即Pb/Te > 1, x = 3.5)时, 化合物由P型传导转变为N型传导, Seebeck系数在整个测试温度范围内均为负值, 且随着 Pb含量的增加、Seebeck系数的绝对值减小、当Pb含 量增加至x > 4.5时,化合物Seebeck系数的绝对值又 略增大. Seebeck系数的绝对值减小的趋势与上面提 到的电阻率随着Pb含量的增加而减小的趋势是一



图 4 $Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe_{20}$ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)的Seebeck系数 与温度的关系图

致的,可能是由于过量的 Pb 提供了电子,使化合物 中电子浓度增大所致(表 1). 当 Pb 含量增加至 x > 4.5时,化合物 Seebeck 系数的绝对值又增大,原因则可 能是由于载流子浓度因过量 Pb 的固溶或氧化而减小. 在整个测试温度范围内,富 Pb 化合物的 Seebeck 系 数的绝对值呈现先增大后减小的变化趋势,在473 K 附近出现极大值.在473 K 以下的温度范围内,由于 杂质能级的激发占主导地位而使得 Seebeck 系数的绝 对值随温度的升高而增大;当温度高于473 K 时,价 带中的电子受热而激发至导带,形成电子-空穴对, 由于空穴对 Seebeck 系数反方向的作用使 Seebeck 系 数的绝对值减小.

根据以上电阻率和Seebeck系数的值,计算得到 Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀化合物的功率因子,结果示于图 5. Ag_{0.8}Pb₁₈SbTe₂₀化合物因其较大的电阻率而使得功率 因子较小,低于 3 μ W/(K² · cm).增加化合物中Pb的 含量,电阻率迅速减小,功率因子也随之大幅度提高, 当 Pb 含量增大至x = 4.5时,化合物组成为 Ag_{0.8}Pb_{22.5}SbTe₂₀,该化合物的功率因子较大,尤其是 在高温区比较明显,673 K时功率因子最大值达到 18 μ W/(K²·cm).当Pb的含量x > 4.5时,由于电阻率增大 而使化合物的功率因子减小.

将实验测得的热扩散系数、密度值以及热容值代入公式 $\kappa = \lambda C_p d$,得到Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀的热导率,结果示于图 6. 从图中可以看到、化合物的热导率随温



图 5 Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)的功率因子与 温度的关系图



图 6 Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)的热导率与
温度的关系图
实心图标和空心图标分别对应于热导率和电子热导率

度的升高大幅度减小. 一般来说, $Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe_{20}$ 化 合物的热导率由晶格热导率(*κ*_L)和电子热导率(*κ*_e)两 部分组成. 根据Wiedemann-Franz's法则, 电子热导率 可由 $\kappa_e = LT/\rho$ 计算得到,其中L为洛仑兹数(对于自由 电子可取值 $2.45 \times 10^{-8} V^2/K^2$), T和 ρ 分别为绝对温度和 电阻率,将以上测得的电阻率的值代入上式,得到 $Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe_{20}$ 化合物的电子热导率,如图 6 中的 空心图所示.随着温度的升高,电阻率减小,相应的 电子热导率增大. 将热导率减去电子热导率得到晶 格热导率($\kappa_{\rm L} = \kappa - \kappa_{\rm e}$)的值. 随着温度的升高、尽管 Ago 8Pb18+rSbTe20化合物的电子热导率增大、但是热 导率仍然减小,原因主要是由于晶格热导率的降低 所致, 而晶格热导率随温度的升高而减小主要是由 于声子-声子散射作用在高温下增强,尤其是U过程 显著增强. 所谓U过程是相对正常过程(N过程)而言 的、N过程是在声子碰撞过程中、参加碰撞的总声子 数可以增加也可以减少,但系统的总能量和准动量 是守衡的. 而U过程则是在两个声子碰撞后成为一个 声子,与N过程的区别在于其准动量不守衡.U过程 有效地减小声子的平均自由程,使声子传输过程中 的热阻增大, 晶格热导率减小. 一般情况下, 在德拜 温度(6h)以上U过程散射是主要的声子散射机制. 从图 6可以看出, $Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe_{20}$ 化合物的热导率和电子 热导率均随着Pb含量的增加而增大. 很显然, 电子热 导率的增加对化合物总热导率的增加起了很大的作 用.

将以上获得的功率因子与热导率的值代入热电 优值表达式 $ZT = \alpha^2 T / \rho \kappa$,得到材料的ZT值与温度的 关系表达式,结果示于图 7. 由以上的结果可知,随 着温度的升高,功率因子增大,热导率减小,结果使 得热电优值*ZT*大幅度增加. 随着 $A_{g_{0.8}}Pb_{18+x}SbTe_{20}$ 化 合物中Pb含量的增加(*x* 3.5),化合物的热电优值 得到大幅度提高.当Pb含量增加至*x* = 4.5 时, $A_{g_{0.8}}Pb_{22.5}SbTe_{20}$ 化合物的热电优值较大,在 673 K时 达到最大,约为 1.2.

论文



图 7 Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀ (x = 0, 3.5, 4, 4.5, 5)的热电优值 与温度的关系图

3 结论

本文采用经济高效的球磨和放电等离子烧结工 艺成功制备了高性能的Ag0.8Pb18+xSbTe20体系块体热 电材料. 材料在中温区(室温~673 K)范围内表现为半 导体传输特性、即电阻率随着温度的升高而减小.由 于声子散射随着温度的升高而增强、晶格热导率大 幅度降低、结果热导率也随之减小、热电优值随着温 度的升高而迅速增大。673 K附近的热电优值比室温 热电优值高一个数量级。由于在SPS烧结过程中Pb的 挥发、适当增加Pb含量有利于提高材料的热电性能、 尤其是电传输性能, 当Pb含量x3.5 时、化合物的 功率因子与Ag_{0.8}Pb₁₈SbTe₂₀化合物相比提高了一个数 量级. 随着Pb含量的增加, 化合物的功率因子先增大 后减小,当Pb含量x = 4.5时,即Ag_{0.8}Pb_{22.5}SbTe₂₀化合 物的功率因子最大,相应的热电优值也较高,最大值 为ZT = 1.2(673 K).

参考文献

 上村欣一,西田勋夫. 热电半导体及其应用. 东京:日刊工业新 闻社,1988.56—60

- 2 李建保,李敬锋.新能源材料及其应用技术.北京:清华大学出版社,2005.333—359
- 3 栾伟玲, 涂善东. 温差电技术的研究进展. 科学通报, 2004, 49(11): 1011—1019
- 4 刘静,李敬锋. 热电材料的应用及研究进展. 新材料产业, 2004, 8: 49—53
- 5 Venkatasubramanian R, Siivola E, Colpitts V, et al. Thin-film thermoelectric devices with high room-temperature figures of merit. Nature, 2001, 413(6856): 597-602[DOI]
- 6 Zhou M, Feng C D, Chen L D, et al. Effects of partial substitution of Co by Ni on the thermoelectric properties of TiCoSb-based half-Heusler compounds. J Alloy Comp, 2005, 194: 391–394
- 7 Zhou M, Chen L D, Feng C D, et al. Synthesis and electrical transport properties of TiCo_{1-x}Pd_xSb half-Heusler compounds. Key Eng Mater, 2005, 280-283: 405-407
- 8 Hicks L D, Harman T C, Sun X S, et al. Experimental study of the effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit. Phys Rev B, 1996, 53: R10493—R10496[DOI]
- 9 Zheng X J, Zhu L L, Zhou Y H, et al. Impact of grain sizes on phonon thermal conductivity of bulk thermoelectric materials. Appl Phys Lett, 2005, 87(24): 242101-242103[DOI]
- 10 Rowe D M. CRC Handbook of Thermoelectrics. New York: CRC Press, 1995. 257—259, 261—266
- Sales B C, Mandrus D, Williams R K. Filled skutterudite antimonides: A new class of thermoelectric materials. Science, 1996, 272: 1325–1328[DOI]
- 12 Sales B C, Chakoumakos B C, Mandrus D, et al. Atomic displacement parameters and the lattice thermal conductivity of clathrate-like thermoelectric compounds. J Solid State Chem, 1999, 146(2): 528—532[DOI]
- 13 余柏林, 祁琼, 唐新峰, 等. 晶粒尺寸对CoSb₃化合物热电性能 的影响. 物理学报, 2005, 54 (12): 5763—5768

- Harman T C, Taylor P J, Walsh M P, et al. Quantum dot superlattice thermoelectric materials and devices. Science, 2002, 297: 2229—2232[DOI]
- 15 Harman T C, Spears D L, Manfra M J. High thermoelectric figures of merit in PbTe quantum wells. J Electr Mater, 1996, 25(7): 1121–1127
- Beyer H, Nurnus J, Bottner H, et al. PbTe based superlattice structures with high thermoelectric efficiency. Appl Phys Lett, 2002, 80(7): 1216—1218[DOI]
- 17 Harman T C, Walsh M P, Laforge B E, et al. Nanostructured thermoelectric materials. J Electr Mater, 2005, 34(5): 680-684
- 19 Quarez E, Hsu K F, Pcionek R, et al. Nanostructuring, compositional fluctuations, and atomic ording in the thermoelectric materials AgPb_mSbTe_{m+2}. The myth of solid solution. J Am Chem Soc, 2005, 127(25): 9177—9190[DOI]
- 20 Lin H, Bozin E S, Billinge S J L, et al. Nanoscale clusters in the high performance thermoelectric AgPb_mSbTe_{m+2}. Phys Rev B, 2005, 72: 174113—174119[DOI]
- 21 Androulakis J, Hsu K F, Pcionek R, et al. Nanostructuring and high thermoelectric efficiency in p-type Ag(Pb_{1-y}Sn_y)_mSbTe_{2+m}. Adv Mater, 2006, 18: 1170–1173[DOI]
- 22 Anderson K R, Groza J R, Fendorf M, et al. Surface oxide debonding in field assisted powder sintering. Mater Sci Eng A, 1999, 270(2): 278-282[DOI]
- 23 Omori M. Sintering, consolidation, reaction and crystal growth by the spark plasma system (SPS). Mater Sci Eng A, 2000, 287(2): 183—188[DOI]
- 24 Wang H, Li J F, Nan C W, et al. High-performance Ag_{0.8}Pb_{18+x}SbTe₂₀ thermoelectric bulk materials fabricated by mechanical alloying and spark plasma sintering. Appl Phys Lett, 2006, 88: 092104–092106[DOI]